

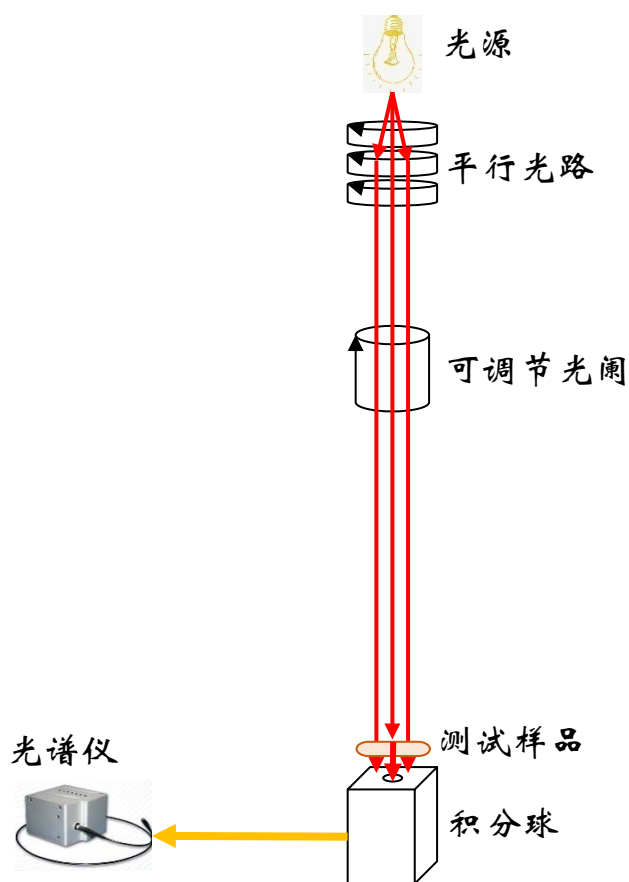
双耀科技

SY-TS110

光学组件透射光谱测量仪



SY-TS110 光学组件透射光谱测量仪是通过对比透光样品的光谱和未通过样品的参考光谱的比值来测量样品的透光率，其测试原理为：a) 光源首先经过平行光路准直成平行光，由可变光阑调节光斑大小照射在测试样品表面；b) 透过测试样品的光由积分球收集，通过光纤传送到光谱仪进行软件分析，计算出透光能量和参考能量的比值，得出测试样品的透射率。



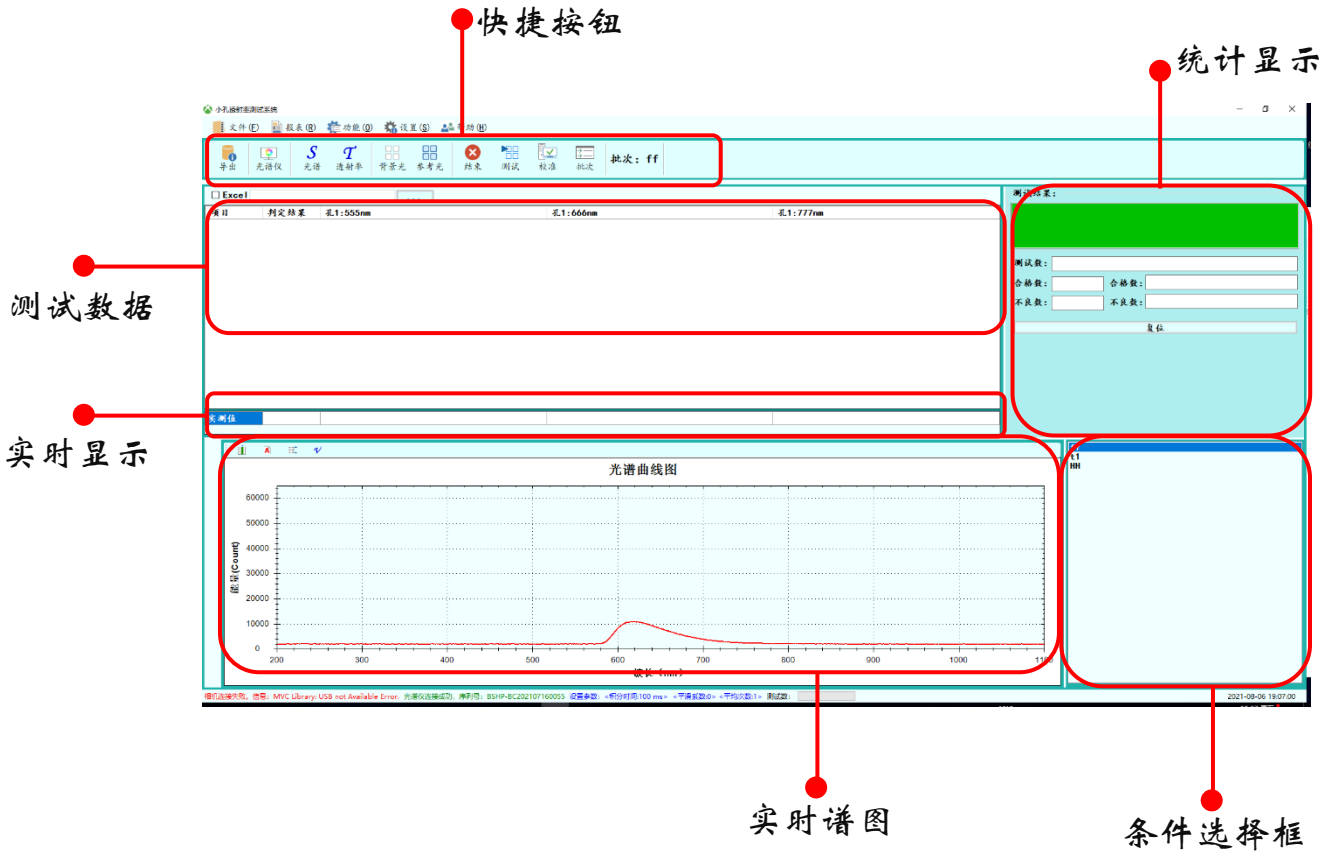
☆ 主要应用：

- 光学组件（镜头、光学模组、光机组件）的透过率测试；
- 望远镜、枪瞄准镜透过率检测；
- 平面玻璃、平面滤光片的透过率检测；
- 显微镜目镜、显微镜物镜透过率检测；

☆ 仪器特点：

- 具有 XZY- $\alpha\beta\gamma$ 多方位调节治具，确保光线沿光轴入射；
- 调节空间大，可测量小于 800mm 长度的光学组件；
- 可调光斑大小，针对测量不同面积的光学组件样品；
- 具有曲线校正、分段校准等修正方法；
- 完整的数据储存方式及报告生成；
- 采用高性能的光谱探测器及稳定测试光源。

☆ 控制软件：



☆ 规格参数:

系统参数	型号	SY-TS110
	波长范围	400-1000nm
	测试精度	±0.2%@400-450nm、±0.1%@460-800nm、 ±0.2%@800-1000nm
	重复性	±0.1%@400-450nm、±0.08%@460-800nm、 ±0.1%@800-1000nm
	光斑大小	Φ2-15mm
检测器	光谱范围	185-1100nm (取决于光栅)
	光学分辨率	0.14-7.7nm (取决于光栅及夹缝)
	杂散光	< 0.08%@600nm, < 0.4%@435nm
	狭缝可选	5um、10um、25um、50um、100um 以及 200um
	传感器	Hamamatsu S-10420
	光路	f/4, 交叉对称的 Czety-Turner
光源	类型	卤素灯
	波长范围	300-1100nm
	寿命	≥2000H
其他	电脑	电脑 x1, Win10 系统
	软件	测试软件 x1
	光纤	专用光纤 (芯径 1000um)
环境	温湿度	0~40° C、70%以下, 无结露
	洁净度	优于 100000 级
	其他	水平放置, 建议放置在防振动的台面上